

# 材料の構造解析のための TEMの基礎と実習

透過型電子顕微鏡(TEM)は、金属材料、半導体デバイス、セラミックなどの欠陥や界面といった局所的な構造や組成を知るうえで欠かせない装置です。金属材料、半導体デバイス、セラミックの特性が欠陥や界面で決まることが多いことを考えると、この装置をよく知っておく必要があります。本講座では、透過型電子顕微鏡の原理、正しい観察手法や正しいデータ解析方法などをわかりやすく解説します。

令和4年 3月3日(木) 10:00~17:00

JAIST ナノマテリアルテクノロジーセンター 2階 会議室

先着5名程度

**対象者** 企業・他大学・公的機関・高専等の研究者・技術者

**受講料** 6,200円

**講師** 大島 義文：マテリアルサイエンス系・教授  
麻生 浩平：マテリアルサイエンス系・助教  
東嶺 孝一：ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術専門員

**申込締切** 令和4年2月17日(木)【定員に達し次第締切】

**申込方法** ①氏名(ふりがな)、②勤務先・職名、③受講の目的、  
④本講座に期待すること、⑤書類送付先、⑥電話番号、  
⑦メールアドレスを明記の上、E-mailまたはFAX(裏面参照)  
でお申し込みください。

北陸先端科学技術大学院大学  
ナノテクノロジープラットフォーム公開講座  
受講申込書

① 氏名	ふりがな
② 勤務先等・職名	
③ 受講の目的	
④ 本講座に 期待すること	
⑤ 書類送付先	〒
⑥ 電話番号	
⑦ メールアドレス	

ありがとうございました

記入もれがないか十分お確かめください。

**FAX番号 0761-51-1455**

FAX番号は、お間違えのないようにお願いします。